12,18

Структура и электрофизические свойства многостенных углеродных нанотрубок, подвергнутых облучению ионами аргона

© Е.В. Князев¹, В.В. Болотов^{1,2}, К.Е. Ивлев¹, С.Н. Поворознюк^{1,3}, В.Е. Кан¹, Д.В. Соколов¹

¹ Омский научный центр СО РАН,

Омск, Россия

² Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского,

Омск, Россия

³ Омский государственный технический университет,

Омск, Россия

E-mail: knyazev@obisp.oscsbras.ru

(Поступила в Редакцию 25 сентября 2018 г.)

Методами комбинационного рассеяния света, растровой и просвечивающей электронной микроскопии, электрофизическими методами исследуется влияние радиационных дефектов на морфологию, структуру и электрофизические характеристики многостенных углеродных нанотрубок (МУНТ). После облучения ионами аргона наблюдается деградация структуры нанотрубок. Отжиг в инертной среде приводит к частичному восстановлению структуры нанотрубок. При этом в их стенках наблюдается локализация участков с восстановленной графеновой структурой и участков, насыщенных протяженными дефектами, искривляющих графеновые слои стенок МУНТ. Такое изменение структуры приводит к резкому снижению проводимости многостенных углеродных нанотрубок.

Работа выполнена с использованием оборудования Омского центра коллективного пользования (ОмЦКП СО РАН)по государственному заданию ОНЦ СО РАН в соответствии с Программой фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы по направлению II.9, проект № II.9.2.1 (номер госрегистрации в системе ЕГИСУ НИОКТР АААА-А17-117041210227-8) при частичной поддержке гранта РФФИ № 16-08-00763 А и при финансовой поддержке РФФИ и Субъекта РФ Омской области в рамках научного проекта № 18-48-550009 р_а.

DOI: 10.21883/FTT.2019.03.47252.259

1. Введение

Многостенные углеродные нанотрубки (МУНТ) являются материалом, который пользуется повышенным интересом исследователей и имеет широкое практическое применение в микро- и нано- электронных устройствах [1,2]. Высокая механическая прочность, широкий диапазон получаемой проводимости, химическая инертность, развитая поверхность ансамблей многостенных углеродных нанотрубок делают их пригодными для изготовления анодов литий-ионных батарей, электродов суперконденсаторов, газочувствительных слоев газовых сенсоров и т.д. [3,4].

Применение МУНТ в различных областях техники подразумевает возможность управления свойствами нанотрубок и получения материала с требуемыми параметрами. Так материал для электродов суперконденсаторов должен обладать низкими значениями сопротивления и высокой химической инертностью [5]. В свою очередь, когда необходимо использование МУНТ в качестве армирующей структуры для чувствительных слоев газовых наносенсоров, от материала — носителя требуется более высокое сопротивление [2] и химическая активность. Однако до настоящего времени синтез нанотрубок с определенными свойствами остается сложной задачей. Наиболее распространенными методами получения углеродных нанотрубок являются дуговой разряд, лазерная абляция и химическое осаждение (Chemical vapor deposition, CVD). Основную долю трубок, полученных методом химического осаждения, составляют МУНТ. Последние обладают высокой проводимостью, низкой сорбционной способностью и низкой химической активностью, что ограничивает их применение, например, в качестве газочувствительных слоев сенсорных наноструктур [2,6].

Структурные особенности углеродных нанотрубок определяют их свойства. В ряде теоретических и экспериментальных работ показано влияние дефектов структуры трубок на их электрофизические свойства [7-9]. Можно предполагать, что управление дефектным составом МУНТ позволит получать нанотрубки с необходимыми для конкретных целей электрофизическими свойствами. Достаточно эффективным способом введения дефектов в структуру МУНТ является облучение потоком заряженных частиц [10]. При этом основными видами вводимых дефектов являются вакансионные дефекты и междоузельные атомы углерода. Известно, что введение вакансии в графеновый слой вызывает перестройку его структуры в области дефекта, а междоузельные атомы углерода оказываются вне графеновой плоскости и, в случае МУНТ, могут образовывать химическую связь между стенками [11]. Помимо формирования вакансий и междоузлий, облучение пучками высокоэнергетичных частиц может стимулировать переход углерода от sp^2 -гибридизированного состояния к sp^3 -гибридизации [12,13]. В свою очередь, термический отжиг в инертной среде приводит к миграции вакансионных дефектов в стенках МУНТ, что может привести как к восстановлению структуры графеновых стенок, так и к образованию в них мультивакансионных дефектов [14–15].

Таким образом, комбинация ионного облучения и термических обработок является эффективным методом воздействия на морфологию и свойства МУНТ, и может использоваться для направленного изменения электрофизических свойств углеродных нанотрубок. Целью настоящей работы было исследование структуры МУНТ при радиационных и термических обработках и её связи с электрофизическими свойствами индивидуальных нанотрубок и их ансамблей.

2. Эксперимент

В данной работе исследовались ограниченные массивы МУНТ подверженные воздействию пучка ионов аргона с последующей температурной обработкой в инертной среде с целью проследить изменения морфологии и структуры, а так же оценить влияние данных обработок на электрофизические свойства многостенных углеродных нанотрубок. Слои МУНТ синтезировались методом CVD при пиролизе ацетонитрила, катализатором служили частицы железа, образующиеся в результате разложения ферроцена. Полученные таким образом МУНТ ориентированы нормально к ростовой подложке [6]. После синтеза образцы подвергались отжигу на воздухе при температуре 390°C в течение 2h для удаления аморфного углерода, формирующегося во время синтеза слоев МУНТ. После термической обработки проводилась химическая очистка образцов в HCl (40%, 24 h) для удаления частиц катализатора с поверхности МУНТ. Очищенные МУНТ диспергировались в ультразвуковой ванне и полученная суспензия на основе этанола наносились спрей-методом на поверхность монокристаллического кремния. В объеме полученного ансамбля нанотрубки располагаются преимущественно копланарно поверхности, за счет чего повышается эффективность ионного воздействия.

Проводилось облучение ионами аргона энергией 5 keV, доза — $1 \cdot 10^{16}$ cm⁻². Термоотжиги проводились в атмосфере аргона при температуре 900°C в течение 30 min.

Структура МУНТ исследовалась методами просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) с использованием электронного микроскопа JEOL JEM-2100, растровой электронной микроскопии (РЭМ) на микроскопе JEOL JSM-6610 LV и спектроскопии комбинационного рассеяния света (КРС) с использованием рамановского фурье-спектрометра BRUKER RFS-100/s. Тестовые структуры для электрофизических измерений представляли собой систему встречноштыревых золотых контактов (расстояние между проводниками — 5μ m), между которыми спрей-методом помещались разреженные ансамбли МУНТ. Измерения проводились на LCR-метре Agilent E4980. Изменение проводимости МУНТ оценивалось по вольт-амперным характеристикам (BAX) тестовых структур.

3. Результаты

Исходные МУНТ обладают металлическим характером проводимости, о чем свидетельствует линейный характер ВАХ тестовых структур (рис. 1). Исследования электрофизических свойств МУНТ показывают, что после каждого типа воздействия наблюдается существенное снижение проводимости нанотрубок и их ансамблей (таблица). Так сопротивление ансамбля исходных МУНТ составляет $\sim 0.16-4$ К Ω , что сопоставимо с литературными данными [10].

Облучение углеродных нанотрубок ионами аргона привело к росту сопротивления с $\sim 4 \, \mathrm{K}\Omega$ до 55 KΩ. Такой эффект, вероятно, связан с введением точечных дефектов в структуру нанотрубок, которые являются центрами рассеяния и существенно снижают подвижность носителей заряда. Термическая обработка в инертной атмосфере аргона предварительно облученных нанотрубок также существенно увеличивает сопротивление исследуемого ансамбля МУНТ до $\sim 0.4-2.5 \, \mathrm{MOm}$. Отжиги в инертной атмосфере МУНТ, насыщенных радиационными дефектами, приводят к восстановлению



Рис. 1. Вольт-амперные характеристики тестовых структур ограниченных массивов МУНТ. *I* — ограниченный массив МУНТ до ионных и температурных обработок(образец № 3); *2* — массив МУНТ, подверженный облучению ионами Ar⁺ (образец № 4); *3* — массив МУНТ, подверженный облучению ионами Ar⁺, с последующей термической обработкой в атмосфере Ar (образец № 8).

Тип воздействия	МУНТ до ионных и температурных обработок			МУНТ, подверженные облучению ионами Ar ⁺			МУНТ, подверженные облучению ионами Ar ⁺ , с последующей термической обработкой в атмосфере Ar		
Образец, №	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сопротивление ансамбля МУНТ (<i>R</i> , kΩ)	3.89	0.5	0.16	55	5.4	11.7	400	2600	960

Сопротивление ограниченного ансамбля МУНТ до и после воздействия

графеновых слоев за счет рекомбинации точечных дефектов [14], однако экстремальной рост сопротивления указывает на дальнейшую трансформацию структурных дефектов в стенках нанотрубок.

Для оценки влияния ионного воздействия и термических обработок на структуру МУНТ была использована интегральная методика комбинационного рассеяния света.

В спектрах КРС исходных ансамблей МУНТ (рис. 2, кривая *I*) присутствуют интенсивные *D*- и *G*-полосы, характерные для графитоподобных материалов [6,16]. *G*-полоса в спектре исходного слоя МУНТ имеет мак-

stim of the second sec

Рис. 2. Спектры КРС ограниченных масивов МУНТ: *1* — массив МУНТ до ионных и температурных обработок; *2* — массив МУНТ, подверженный облучению ионами Ar⁺; *3* — массив МУНТ, подверженный облучению ионами Ar⁺, с последующей термической обработкой в атмосфере Ar.

симум при 1583 cm⁻¹, характерный для высокоупорядоченных углеродных материалов с *sp*²-гибридизацией. Анализ спектра исходных МУНТ (см. рис. 1, кривая 1) выявляет полосу при 1500 cm⁻¹, свидетельствующую о наличии аморфного углерода в образце [16]. При воздействии пучка ионов аргона происходит практически полное разупорядочение структуры МУНТ, о чем свидетельствуют исчезновение выделенных D- и G-полос в спектрах КРС и появление на их месте широкой полосы, характерной для аморфного углерода (см. рис. 2, кривая 2). В спектрах КРС образцов, подверженных отжигу при 900°С после облучения, надежно идентифицируются D- и G-полосы, что говорит об изменении структуры дефектных УНТ при термообработке (см. рис. 2, кривая 3). При детальном анализе спектра можно выделить полосу при $1100-1200 \,\mathrm{cm}^{-1}$. Ее наличие можно связать с присутствием в слоях фракции *sp*³-гибридизированного углерода [17]. В спектрах слоев МУНТ после облучения и отжига также присутствует широкая полоса при 1500 ст⁻¹. Это свидетельствует о неполном восстановлении графеновой структуры МУНТ с образованием дефектных областей в стенках нанотрубок, атомы углерода в которых являются четырехкоординированными.

По данным РЭМ, исходные ансамбли МУНТ состояли из нанотрубок с диаметрами 20–100 nm (рис. 3, *a*), при этом большая часть трубок (~ 85%) имеет внешний диаметр от 20 до 60 nm. На РЭМ-изображениях слоя МУНТ видно, что трубки располагаются преимущественно параллельно подложке, образуя сеть со множеством пересечений трубок, что обусловлено методом нанесения МУНТ на подложку. Толщина слоя нанотрубок варьировалась от 1 до 5 μ m.

В результате воздействия ионов Ar^+ на ансамбли МУНТ, наблюдается значительное уменьшение числа трубок с диаметром менее 40 nm (рис. 2, *b*). Большинство нанотрубок приобрело значительную неравномерность по внешнему диаметру. У отдельных трубок толщина меняется от 80 до 30 nm. В ряде случаев, в местах соприкосновения двух или более трубок наблюдаются спаивание трубок между собой с образование метутов МУНТ. Помимо этого появляются многочисленные обрывы трубок, имеющие округлую форму и размер 70 ± 20 nm. Эти обрывы произошли, вероятно,



— 200 nm



Рис. 3. РЭМ-изображение ансамбля МУНТ. *а* — массив МУНТ до ионных и температурных обработок; *b* — массив МУНТ, подверженный облучению ионами Ar⁺, с последующей термической обработкой в атмосфере Ar; *d* — выделенный фрагмент с рис. 3, *c*. *I* — обрывы трубок; *2* — спайки двух и более углеродных трубок; *3* —- изменение диаметра трубки.

при локальном распылении дефектных участков МУНТ в процессе облучения. (рис. 3, *b*).

Термические обработки приводят к миграции дефектов, поэтому следует ожидать дальнейшей модификации структуры МУНТ после отжигов. Так, на снимках в РЭМ наблюдается частое изменение диаметра нанотрубок, при этом нанотрубка приобретает гофрированный вид (рис. 3, d). Также наблюдаются сшивание трубок, с образованием жгута и спаивание двух и более нанотрубок (рис. 3, c).

Данные просвечивающей электронной микроскопии коррелируют с данными КРС и РЭМ. В ПЭМ-изображениях исходных МУНТ видна бамбукообразная структура МУНТ, характерная для данного вида синтеза [13]. Отчетливо видна структура стенок МУНТ (рис. 4), состоящих из протяженных и относительно ровных отдельных слоев.

Данные ПЭМ свидетельствуют о формировании множества точечных дефектов в структуре нанотрубки после облучения ионами аргона. Графеновые слои стенок МУНТ имеют разрывы и искривления, что, вероятно, связано с перестройкой графеновых плоскостей при фор-



— 5 nm

Рис. 4. ПЭМ-изображение МУНТ до ионных и температурных обработок.



Рис. 5. ПЭМ-изображение МУНТ, подверженные облучению ионами Ar⁺. *a* — общий вид нанотрубки; *b* — структура стенки нанотрубки. *1* — область с удаленными внешними слоями стенки МУНТ.

мировании вакансионных дефектов [14]. По результатам быстрого фурье-преобразования, межслоевое расстояние графеновых слоев после облучения увеличивается с 0.34 nm до 0.38 nm. Также на внешней поверхности нанотрубки наблюдается удаления части графеновых слоев (рис. 5, a). Однако при данной плотности облучения не наблюдается полной аморфизации стенок нанотрубки (рис. 4, b).

Известно, что высокотемпературный отжиг в инертной атмосфере приводит к восстановлению структуры МУНТ [14,17,18]. Однако данные ПЭМ свидетельствуют о неполном восстановлении структуры трубок после отжига (рис. 6, a). На некоторых участках трубок наблюдается восстановление графеновых слоев. Структура стенок МУНТ становится схожей с исходными образцами (рис. 6, с). Однако также наблюдается формирование протяженных дефектов в стенках трубок, затрагивающих все графеновые слои трубки (рис. 6, b). Такие дефекты приводят к локальному искривлению стенки трубки. При этом наблюдается формирование изгиба графеновых слоев стенки МУНТ. При значительных количествах протяженных дефектов в структуре стенки МУНТ наблюдается чередование участков стенки с изгибом и восстановленной графеновой структурой (рис. 6, а). Схожее поведение графеновых слоев наблюдается при формировании мультивакансионных дефектов [15].

Такое изменение структуры нанотрубок можно объяснить миграцией междоузельных атомов углерода при отжиге. При этом происходит рекомбинация вакансий и междоузельных атомов углерода о чем свидетельствует восстановление графеновой структуры стенок МУНТ. Помимо миграции междоузельных атомов углерода, обладающих высокой подвижностью в стенках МУНТ, возможна и миграция вакансий, на что указывают авторы теоретических исследований [11,15]. Вакансионные дефекты способны взаимодействовать с образованием вакансионных кластеров, обладающих меньшей подвижностью.

4. Обсуждение

Исследование показало связь электрофизических свойств МУНТ с их структурой. Ионные и термические обработки значительно изменяют морфологию отдельных нанотрубок и их ансамблей, при этом наблюдается рост сопротивления образцов с ~ 4 до $10^{-55}\,\mathrm{K}\Omega$ (таблица).

Как показывают данные спектроскопии КРС и электронной микроскопии, при ионных обработках происходит деградация внутренней структуры МУНТ. При этом нарушается пространственная упорядоченность бензольных колец в графеновых стенках нанотрубок, характерных для sp^2 -гибридизированных атомов углерода (рис. 1, кривая 2). В целом растет дефектность и разупорядоченность стенок МУНТ, происходит аморфизация стенок МУНТ (рис. 5, b), разрушение внешних графеновых слоев (рис. 5, a) и увеличение межслоевого расстояния стенок МУНТ. Благодаря появлению разорванных связей и адатомов, происходит образование жгутов и спаек нанотрубок (рис. 3, b). Таким образом, рост сопротивления ансамбля МУНТ после облучения можно связать с введением радиационных дефектов в графитоподобную структуру стенок МУНТ. Такие дефекты действуют как рассеивающие центры и центры захвата свободных носителей, и, как следствие, снижением подвижности носителей заряда [9,19].



• 20 nm







Рис. 6. ПЭМ-изображение МУНТ, подверженные облучению ионами Ar⁺, с последующей термической обработкой в атмосфере Ar; *a* — общий вид нанотрубки; *b* — изображение выделенного дефекта стенки МУНТ; *c* — восстановленные после отжига графеновые слои стенки МУНТ.

Отжиг в среде аргона при температуре 900°С приводит к дальнейшему росту сопротивления исследуемого материала до ~ 0.4-2.6 М Ω , наряду с частичным восстановлением структуры в МУНТ (рис. 1, кривая 3). Такое поведение можно связать с дальнейшей трансформацией дефектов. Так, данные электронной микроскопии и КРС указывают на наличие процессов рекристаллизации структуры МУНТ при термических обработках, приводящих к частичному восстановлению морфологии трубок.

Стенки МУНТ после отжига состоят из последовательно чередующихся участков с восстановленной графитоподобной структурой и обширных разупорядоченных и дефектных областей (рис. 6, *a*). На участках с восстановленной структурой наблюдается восстановление межслоевого расстояния — с 0.38 nm после облучения до 0.34 nm после отжига. Участки с восстановленными графеновыми слоями перемежаются с участками с искривлениями и закруглениями стенки МУНТ, содержащими протяженные дефекты (рис. 6, b) [20]. В дефектных областях, вероятно, существенно снижена подвижность носителей заряда, а чередование с графитоподобными участками создает цепь последовательно соединенных гетеропереходов.

Таким образом, рост сопротивления после отжига может объясняться геометрическим фактором, связанным с уменьшением сечения проводника после обработок, а также последовательным чередованием в стенке МУНТ

b

участков с восстановленной графеновой структурой и разупорядоченных областей, на границах которых возможно формирование гетеропереходов и потенциальных барьеров для протекания тока.

5. Заключение

Данные электрофизических исследований, комбинационного рассеяния света и электронной микроскопии показали возможность направленного изменения внутренней структуры многостенных углеродных нанотрубок путем воздействия на них ионного облучения и последующих отжигов в инертной атмосфере. Комбинация данных воздействий является эффективным способом функционализации углеродных нанотрубок и модификации их электрофизических свойств.

Авторы выражают благодарность Ю.А. Стенькину за синтез МУНТ и М.В. Тренихину за помощь в проведении эксперимента.

Список литературы

- [1] Г.С. Иванченко, Н.Г. Лебедев. ФТТ 51, 2281 (2009).
- [2] В.В. Болотов, В.Е. Кан, П.М. Корусенко, С.Н. Несов, С.Н. Поворознюк, И.В. Пономарева, В.Е. Росликов, Ю.А. Стенькин, Р.В. Шелягин, Е.В. Князев. ФТТ 54, 154 (2012).
- [3] И.В. Запороцкова, Н.П. Борознина, Ю.Н. Пархоменко, Л.В. Кожитов. Изв. вузов. Материалы электрон. техники 5, 21 (2017).
- [4] P. Bondavalli, P. Legagneux, D. Pribat. Sensors Actuators B 140, 304 (2009).
- [5] P. Jampani, A. Manivannan, P.N. Kumta. The Electrochem. Soc. Interface 19, 57 (2010).
- [6] В.В. Болотов, В.Е. Кан, Н.А. Давлеткильдеев, И.В. Пономарева, О.В. Кривозубов, А.В. Окотруб, А.Г. Кудашов. Перспектив. материалы 3, 24 (2009).
- [7] R. Juarez-Mosqueda, M. Ghorbani-Asl, A. Kuc, T. Heine. Phys. Chem. C 118, 13936 (2014).
- [8] S. Baldo, S. Scuderi, V. Tripodi, L. La Magna, A. Leonardi, S.G. Donato, N. Neri, G. Filice, S. Scalese, S.J. Sens. Sens, Syst. 4, 25 (2015).
- [9] Y. Ma, B. Yin, H. Bai, X. Ding, Y. Cao, Q. Li, Y. Ji. Mater. Res. Express 3, 055016 (2016).
- [10] A. Ishaq, L. Yan, D. Zhu. Instrum. Meth. Phys. Res. B 267, 1779 (2009).
- [11] O. Lehtinen, T. Nikitin, A.V. Krasheninnikov, L. Sun, F. Banhart, L. Khriachtchev, J. Keinonen. New J. Phys. 13, 073004 (2011).
- [12] A. Ishaq, Shahid Iqba, Naveed Ali, A.A. Khurram, A.U. Akrajas, C.F. Dee, Shahzad Naseem, H.M. Rafique, Yan Long. New Carbon Mater. 28, 81 (2013).
- [13] V.V. Bolotov, P.M. Korusenko, S.N. Nesov, S.N. Povoroznyuk, E.V. Knyazev. Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. 337, 1 (2014).
- [14] Z. Xu, L. Xu, F. Fang, H. Gao, W. Li. Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. B 307, 203 (2013).

- [15] J.Y. Huang, S. Chen, Z.F. Ren, Z.Q. Wang, D.Z. Wang, M. Vaziri, Z. Suo, G. Chen, M.S. Dresselhaus. Phys. Rev. Lett. 97, 075501 (2006).
- [16] В.В. Болотов, В.Е. Кан, М.Ю. Бирюков, Е.В. Князев, Р.В. Шелягин, Ю.А. Стенькин. ФТТ 55, 1360 (2013).
- [17] A.C. Ferrari, J. Robertson. Phys. Rev. B 63, 121405 (2001).
- [18] A. Figaro, J. Pourchez, D. Boudard, V. Forest, S. Berhanu, J.-M. Tulliani, J.-P. Lecompte, M. Cottier, D. Bernache-Assollant, P. Grosseau. J. Nanopart Res. 17, 194 (2015).
- [19] Н.А. Давлеткильдеев, Д.В. Соколов, В.В. Болотов, И.А. Лобов. ПЖТФ 43, 47 (2017).
- [20] Reetu Kumari, Fouran Singh, Brajesh S. Yadav, Ravinder K. Kotnala, Koteswara Rao Peta, Pawan K. Tyagi, Sanjeev Kumar, Nitin K. Puri. Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. B 412, 115 (2017).

Редактор К.В. Емцев